```
1/5/3
 DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
 (c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
 009496191
              **Image available**
 WPI Acc No: 1993-189727/199324
 Related WPI Acc No: 1993-176633; 1993-176634; 1993-176943
 XRPX Acc No: N93-145821
   Coating of substrate esp. with electrically insulating layers - employs
   sputtering chamber with cathode supply transformer having series resonant
   inductance-capacitance circuit across sec. winding
 Patent Assignee: LEYBOLD AG (LEYB )
 Inventor: BRAEUER G; SZCZYRBOWSKI J; TESCHNER G; SZCYRBOWSKI J
 Number of Countries: 011 Number of Patents: 007
 Patent Family:
                Kind
                                               Kind
 Patent No.
                       Date
                               Applicat No
                                                      Date
                                                               Week
 EP 546293
                     19930616
                               EP 92118239
                                                    19921024
                                                              199324 B
                 A1
                                                Α
                               DE 4204998
 DE 4204998
                 A1
                     19930826
                                                A
                                                    19920219
                                                              199335
                               JP 92314863
                                                    19921125
 JP 5222530
                 Α
                     19930831
                                                A
                                                              199339
                               US 92900575
 US 5415757
                     19950516
                                                    19920618
                 Α
                                                A
                                                              199525
                               US 92900580
                                                    19920618
                                                Α
                               US 93161053
                                                    19931201
 EP 546293
                 B1
                     19950705
                                                              199531
                                                    19921024
 DE 59202813
                     19950810
                               DE 502813
                                                Α
                                                              199537
                 G
                               EP 92118239
                                                    19921024
                                                Α
 ES 2074320
                     19950901
                               EP 92118239
                                                    19921024
                                                              199541
 Priority Applications (No Type Date): DE 4204998 A 19920219; DE 4138794 A
   19911126; DE 4138793 A 19911126; DE 4204999 A 19920219
 Cited Patents: DD 221202: DD 252205; DE 1025234; DE 1068972; EP 186865; US
    5082546
 Patent Details:
 Patent No Kind Lan Pg
                                       Filing Notes
                           Main IPC
 EP 546293
                A1 G 10 H01J-037/34
    Designated States (Regional): BE CH DE ES FR GB IT LI NL
                       6 C23C-014/35
 DE 4204998
                                        Add to patent DE 4138794
                A1
 JP 5222530
                       6 C23C-014/35
                Α
 US 5415757
                      12 C23C-014/34
                                        Cont of application US 92900575
                Α
                                        Cont of application US 92900580
                B1 G 11 H01J-037/34
 EP 546293
    Designated States (Regional): BE CH DE ES FR GB IT LI NL
                         H01J-037/34
 DE 59202813
                                        Based on patent EP 546293
                G
                         H01J-037/34
 ES 2074320
                T3
                                        Based on patent EP 546293
 Abstract (Basic): EP 546293 A
          The substrate (7) is coated by sputtering from electrically
      conductive targets (3,4) in a reactive atmos. in an evacuable chamber
      (15). Separate anodes (5,6) are provided in a plane between the
      cathodes (1,2) and substrate.
          Both outputs (12a,12b) from the sec. winding of a transformer (12)
      fed from a medium-frequency generator (13) are connected to the
      cathodes by supply lines (20, 21), joined by a branch (22) contg. the
      series resonant circuit (19,18), and earthed via DC networks (16,17).
          ADVANTAGE - Asymmetrical sputtering is possible with part of the
```

power supplied to one cathode (2) abstracted during alternate half-cycles by a diode (26) and resistance (27).

```
1/5/3
 DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
  (c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
 009483099
 WPI Acc No: 1993-176634/199322
 Related WPI Acc No: 1993-176633; 1993-176943; 1993-189727
  XRAM Acc No: C93-078836
 XRPX Acc No: N93-135342
    Process and appts. for coating substrate - uses current source connected
    to cathodes in evacuated coating chamber
  Patent Assignee: LEYBOLD AG (LEYB )
  Inventor: BRAEUER G; SZCZYRBOWSKI J; TESCHNER G; SZCYRBOWSKI J
 Number of Countries: 003 Number of Patents: 003
 Patent Family:
 Patent No
                 Kind
                         Date
                                  Applicat No
                                                   Kind
                                                           Date
                                                                     Week
                  A1 19930527
                                  DE 4138794
                                                         19911126
 DE 4138794
                                                                    199322 B
                                                    Α
⇒ JP 5222530
                                   JP 92314863
                                                         19921125
                       19930831
                   Α
                                                    Α
                                                                    199339
                                  US 92900575
 US 5415757
                       19950516
                                                    A
                                                         19920618
                   Α
                                                                    199525
                                  US 92900580
                                                         19920618
                                                    Α
                                  US 93161053
                                                         19931201
  Priority Applications (No Type Date): DE 4138794 A 19911126; DE 4204998 A
    19920219; DE 4138793 A 19911126; DE 4204999 A 19920219
  Patent Details:
  Patent No Kind Lan Pg
                                           Filing Notes
                              Main IPC
                          6 C23C-014/35
  JP 5222530
                 Α
  US 5415757
                        12 C23C-014/34
                                           Cont of application US 92900575
                 Α
                                           Cont of application US 92900580
  DE 4138794
                            C23C-014/35
                 A 1
  Abstract (Basic): DE 4138794 A
           Process for coating a substrate (7), esp. with non-conducting
       layers, of electrically conducting targets (3,4) in reactive
      atmosphere, uses a current source (12, 13, 14) connected to cathodes
      (1,2) in an evacuated coating chamber (15), which act electrically together with the targets (3,4) that are then sputtered. The sputtered
      particles are formed on the substrate.
            The novelty is that both exits (12a, 12b) of the sec. coil of a
      transformer, connected to a ave. freq. generator (13) using an impedance coil (14) are connected to a cathode (1 or 2) via two supply
      lines (20,21). Both lines are connected to a first branch line (22), in
      which is located a resonant circuit, pref. a coil (19), and a capacitor
      (18). Each line is connected not only via a first network (16 or 17) to a coating chamber (15) but also via a corresponding second network (8
      or 9) to each anode (5 or 6). The coupling (10) between the coil (19) and first line (20) is connected to the cathode of a rectifier diode
      (26) whilst the anode of (26) is connected to the coupling (11) between
      the capactor (18) and the second line (21). Both cathodes (1,2) are
      operated with a free performance ratio.
            ADVANTAGE - During the coating process using magnetron sputtering
      source in reactive atmosphere arcs disappear or the tendancy for arcs
      to appear is reduced.
           0 r
           Dwg. 1/1
 Title Terms: PROCESS; APPARATUS; COATING; SUBSTRATE; CURRENT; SOURCE;
    CONNECT: CATHODE: EVACUATE: COATING: CHAMBER
 Derwent Class: L03; M13; U11; V05; X14
  International Patent Class (Main): C23C-014/34; C23C-014/35
```

International Patent Class (Additional): C23C-014/06; H01J-037/34

File Segment: CPI: EPI

# (19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-222530

(43)公開日 平成5年(1993)8月31日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 2 3 C 14/35

8414-4K

審査請求 未請求 請求項の数2(全 6 頁)

特願平4-314863 (21)出願番号

(22)出願日

平成 4年(1992)11月25日

(31)優先権主張番号 P4138794。5

(32)優先日

1991年11月26日

(33)優先権主張国

ドイツ (DE)

(31)優先権主張番号 P4204998.9

(32)優先日

1992年2月19日

(33)優先権主張国

ドイツ (DE)

(71)出願人 390023733

ライポルト アクチェンゲゼルシャフト LEYBOLD AKTIENGESEL

LSCHAFT

ドイツ連邦共和国 ハーナウ ヴィルヘル

ムーローンーシュトラーセ 25

(72)発明者 ギュンター プロイアー

ドイツ連邦共和国 フライゲリヒト 2

アム ヘルゲンホイスヒェン 10

(72)発明者 ヨーアヒム スツィルポフスキー

ドイツ連邦共和国 ゴルトパッハ リング

オーフェンシュトラーセ 5

(74)代理人 弁理士 矢野 敏雄 (外2名)

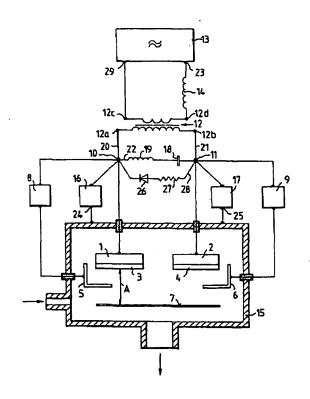
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 基板の被覆方法および被覆装置

# (57)【要約】

【目的】 反応雰囲気中に発生するアークを可能な限り 完全に消失させるか、またはアーク形成の傾向が高まる プロセスフェーズ中に既に、この傾向を識別しそれに反 対に作用する。

【構成】 プラズマ放電が交流電圧の零点通過の際に消 失し、交流電圧の各半波の際に変成器(12)の電圧が 十分に上昇すると直ちに新たに点弧するように中位周波 電圧が低く選定されており、チョークコイル(14)を 介して中位周波発生器(13)と接続された変成器(1 2) の二次巻線の出力側(12a、12b) がそれぞれ 給電線路(20、21)を介してカソードの1つ(1な いし2)と接続されており、給電線路(20、21)は 分岐線路 (22) を介して相互に接続されているように 構成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板(7)に例えば非導電性層を、反応性(例えば酸化)雰囲気内で導電性ターゲット(3、4)から被覆する方法であって、

電流源(12、13、14)を有し、該電流源は排気可能な被覆室(15)に配置されたカソード(1、2)も含めた磁石と接続されており、

該カソードは電気的にターゲット(3、4)と共働し、 該ターゲットはスパッタされ、該ターゲットのスパッタ される粒子は基板(7)上にデポジットされ、

相互にかつスパッタ室(15)から電気的に分離された 2つのアノード(5、6)が配置されており、該アノードはカソード(1、2)と基板(7)との間の同一の平面内に設けられている、基板の被覆方法において、

チョークコイル(14)を介して中周波発生器(13)と接続された変成器(12)の二次巻線の2つの出力側(12a、12b)はそれぞれ、2つの給電線路(20、21)を介してカソード(1ないし2)に接続されており、該第1および第2の給電線路(20、21)は第1の分岐線路(22)を介して相互に接続されており、

該分岐線路には発振回路、有利にはコイル(19)とコンデンサ(18)が挿入接続されており、

2つの給電線路(20、21)の各々は、アースに対する直流電圧電位を設定する第1の結合回路網(16ないし17)を介して被覆室(15)と接続され、かつ相応の第2の結合回路網(8ないし9)を介してそれぞれのアノード(5ないし6)と接続され、

コイル (1.9) と第1の給電線路 (20) との間の接続点は整流ダイオード (26) のカソードと接続されており、

整流ダイオード (26) のアノードは、抵抗 (27) を 介して、コンデンサ (18) と第2の給電線路 (21) との間の接続点 (11)に接続されており、

2つのカソード(1、2)は任意に選択可能な電力比関 係性を以て駆動可能であることを特徴とする、基板の被 覆方法。

【請求項2】 基板(7)に例えば非導電性層を、反応性(例えば酸化)雰囲気内で導電性ターゲット(3、4)から被覆する装置であって、

電流源(12、13、14)を有し、該電流源は排気可能な被覆室(15)に配置されたカソード(1、2)も含めた磁石と接続されており、

該カソードは電気的にターゲット(3、4)と共働し、 該ターゲットはスパッタされ、該ターゲットのスパッタ される粒子は基板(7)上にデポジットされ、

相互にかつスパッタ室(15)から電気的に分離された 2つのアノード(5、6)が配置されており、該アノー ドはカソード(1、2)と基板(7)との間の同一の平 面内に設けられている、基板の被覆装置において、 チョークコイル (14)を介して中位周波発生器 (13)と接続された変成器 (12)の二次巻線の2つの出力側 (12a、12b)はそれぞれ、2つの給電線路 (20、21)を介してカソード (1ないし2)と接続されており、

第1および第2の給電線路は第1の分岐線路(22)を 介して相互に接続されており、

該分岐線路には発振回路、有利にはコイル(19)とコンデンサ(18)が挿入接続されており、

2つの給電線路(20、21)の各々はそれぞれ、アースに対して直流電圧電位を設定する第1の結合回路網(16ないし17)を介して被覆室(15)と接続され、かつ相応の第2の結合回路網(8ないし9)を介してそれぞれのアノード(5ないし6)と接続されており、

コイル(19)と第1の給電線路(20)との間の接続 点は整流ダイオード(26)のカソードと接続されてお り、

整流ダイオード(26)のアノードは抵抗(27)を介して、コンデンサ(18)と第2の給電線路(21)との間の接続点に接続されており、

2つのカソード(1、2)は任意に選択可能な電力比関係性を以て駆動可能であることを特徴とする、基板の被覆装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、基板に例えば非導電性層を、反応性(例えば酸化)雰囲気内で導電性ターゲットから被覆する方法であって、電流源を有し、該電流源は排気可能な被覆室に配置されたカソードも含めた磁石と接続されており、該カソードは電気的にターゲットと共働し、該ターゲットはスパッタされ、該ターゲットのスパッタされる粒子は基板上にデポジットされ、相互にかつスパッタ室から電気的に分離されたアノードが配置されており、該アノードはカソードと基板との間の1つの平面に設けられている、基板の被覆方法および被覆装置に関する。

### [0002]

【従来の技術】既に薄膜を製造するためのスパッタリング装置は公知である(DD252205)。この装置は磁気系と、その上に配置された少なくとも2つの電極を有する。電極はスパッタされるべき材料からなる。その際この電極は、ガス放電のカソードとアノードに交互になるように構成される。電極はこの目的のために、有利には50Hzの正弦波状交流電圧に接続される。

【0003】この公知のスパッタリング装置は特に、反応性スパッタにより誘電層をデポジットするのに適する。約50Hzで装置を駆動することにより、アノードでのフリッカ形成と、金属被覆の場合は電気的短絡(いわゆるアーク)の発生するのが回避される。

【0004】薄いフィルムをスパッタするための別の公知の装置では、種々異なる材料の層のデポジット速度を制御することができる(DE3912572)。これにより非常に薄い薄膜パケットを得ることができる。この装置では、異なる形式の少なくとも2つの対向電極がカソード側に配置されている。

【0005】さらに、高周波カソードスパッタリングにより金属合金をデポジットする装置が公知である(DE3541621)。この装置では、交互に2つのターゲットが制御される。しかしここでターゲットはデポジットさるべき金属合金の金属成分を種々異なる割合で含んでいる。基板はこの目的のために基板支持体に配置される。基板支持体は駆動ユニットによりスパッタリング過程中回転させられる。

【0006】さらに公開された刊行物(DE3802852)により基板を被覆するための装置が公知である。この装置は2つの電極と、少なくとも1つのスパッタすべき材料を有している。被覆すべき基板は2つの電極間に空間的に距離を置いて配置され、交流電流が実質的に同じ振幅を有する低周波半波として選択される。

【0007】前に公開された別の刊行物(DE2243708)によれば、動作ガス内に配置された電極装置を有するグロー放電を形成するための方法が公知である。電極装置には動作電圧が印加される。この方法は磁界の形成によるものであり、磁界は電極装置と共に、電極装置から放出される実質的にはすべての電子を保持するためのトラップを形成する。この電子は動作ガスをイオン化するのに十分なエネルギを有している。この方法に対しては、電極が対で設けられた電極装置が使用される。この刊行物は例えば中空電極についても述べている。中空電極の内部空間にはグロー放電が形成され、電極は管状シェルとして構成されている。

【0008】さらに先行出願(P4106770.3) には、電気的に絶縁された材料、例えば二酸化珪素(S i ○2) を有する基板を反応被覆するための方法および 装置が記載されている。この装置は交流電流源を有し、 この電流源は被覆室に配置された磁石と、カソードも含 めて接続されている。カソードはターゲットと共に作用 し、交流電流源のアースされていない2つの出力側は夕 ーゲットを支持するそれぞれ1つのカソードと接続され ている。被覆室内の2つのカソードは相互に並んでプラ ズマ空間に設けられており、対向する基板に対してそれ ぞれほぼ同じ空間的距離を有している。放電電圧の作用 値は、線路を介してカソードに接続された電圧作用値検 出部により測定され、直流電圧として制御器に線路を介 して供給される。制御器は制御弁を介して反応ガス流を 容器から分配管路へ、測定された電圧が目標電圧と一致 するように制御する。

【0009】さらに基板を反応被覆するための装置が先 行特許出願(P4136655.7; P404228 9. 5) に記載されている。この装置では、電気的に真空室とは別個の、マグネトロンカソードとして構成されたカソードが設けられており、このカソードは電気的に相互に別個の2つの部分からなる。ヨークと磁石を有するターゲット基体が一方の部分としてコンデンサを介して、直流電圧供給部の負極と接続され、ターゲットが他方の部分として線路を介し、チョークとこれに並列に接続された抵抗を介して電流供給部と接続されている。ターゲットは別のコンデンサを介して電流供給部のプラス極およびアノードと接続されている。アノードは抵抗を介してアースに接続されている。その際インダクタンスが、抵抗に対する値は典型的には2kΩから10kΩである。

【0010】この比較的に古い装置は既に、被覆プロセス中に発生するアークのほとんどの数を抑圧し、アークのエネルギを低減し、アーク後のプラズマの再点弧を改善するように構成されている。

#### [0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、マグネトロンスパッタ源を用いた被覆プロセス中に、反応雰囲気中に発生するアークを可能な限り完全に消失させるか、またはアーク形成の傾向が高まるプロセスフェーズ中に既に、この傾向を識別しそれを阻止するように構成することである。またスパッタプロセスの安定度はさらに反応コンテナ内の残留水蒸気に特に不感であるようにする。

【0012】アーク形成の傾向に対抗する本発明の装置 の特性は、ガラス板を金属導電性ターゲットにより被覆 するため反応性(例えば酸化)雰囲気内で非導電性層を デポジットする方法に適する。

【0013】さらにすべてのカソードは任意に選択可能な電力比関係性を以て駆動することができ、それにより電力電位はカソードに対して非対称である。

# [0014]

【課題を解決するための手段】この課題は本発明の方法より、チョークコイルを介して中周波発生器と接続された変成器の二次巻線の2つの出力側はそれぞれ、2つの給電線路を介してカソードに接続されており、該第1および第2の給電線路は第1の分岐線路を介して相互に接続されており、該分岐線路には発振回路、有利にはコンデンサが挿入接続されており、2つの給電線路には立てがある。2つの治電線路に対する直流電圧電位を設定する第1の結合回路網を介してそれぞれのアノードと接続され、コイルと第1の給電線路との間の接続点は整流ダイオードのカソードと接続されており、整流ダイオードのカソードと接続されており、整流ダイオードのカソードと接続されており、整流ダイオードのカソードと接続されており、整流ダイオードのカソードは、抵抗を介して、コンデンサと第2の給電線路との間の接続点に接続されており、2つのカソードは、抵抗を介して、コンデンサと第2の給電線路に選択可能な電力比関係性を以て駆動可能であるよ

うに構成して解決される。

【0015】本発明による装置では、チョークコイルを 介して中位周波発生器と接続された変成器の二次巻線の 2つの出力側はそれぞれ、2つの給電線路を介してカソ ードと接続されており、第1および第2の給電線路は第 1の分岐線路を介して相互に接続されており、該分岐線 路には発振回路、有利にはコイルとコンデンサが挿入接 続されており、2つの給電線路の各々はそれぞれ、アー スに対して直流電圧電位を設定する第1の結合回路網を 介して被覆室と接続され、かつ相応の第2の結合回路網 を介してそれぞれのアノードと接続されており、コイル と第1の給電線路との間の接続点は整流ダイオードのカ ソードと接続されており、整流ダイオードのアノードは 抵抗(27)を介して、コンデンサと第2の給電線路と の間の接続点に接続されており、2つのカソードは任意 に選択可能な電力比関係性を以て駆動可能であるように 構成される。

【0016】本発明ではカソードを"ソフト"に点弧することが重要である。このことはチョークを用いて行うことができる。チョークは変成器と中位周波発生器との間に挿入接続される。さらに消弧用発振装置がカソード間に設けられている。この装置はアークにより発振へと励振することができ、アークを再発振の際に消弧する。発振回路の固有共振周波数はその際、装置の動作周波数の倍数でなければならない。

【0017】本発明では種々の実施例が可能である。そのうちの1つを図面に示された回路模式図により説明する。

[0018]

【実施例】被覆室15では2つのカソード1、2に中位 周波発生器13から2つの給電線路20、21を介して 40kHzの正弦波状交流電流が給電される。この給電 は2つのカソードがスパッタリング放電のマイナス極と プラス極に交互になるように行われる。

【0019】被覆室15には2つのマグネトロンカソード1、2が、この2つのカソード間でプラズマが点弧され得るように隣接して配置されている。その際カソードは、カソード上に配置されたターゲット3、4の表面が1つの平面内にあり、基板7の平面に平行に存在し、相互にそして基板平面に対して角度をもって配置されている。

【0020】ターゲット3、4と基板面との間では距離Aが保持されている。この中間室内には電極5、6が配置されている。電極は電気結合回路網8と9を介してカソード1ないし2と接続点10ないし11で接続されている。

【0021】接続点10ないし11では、カソード1ないし2がさらに変成器12の二次巻線の端子12a、12bとそれぞれ接続されている。この変成器12はそのエネルギを中位周波発生器13から受け取る。この中位

周波発生器13の出力端子23はチョークコイル14の 端子と接続されている。中位周波発生器13の他方の端子29は変成器12の一次巻線の端子12cと接続され ており、変成器12の一次巻線の他方の端子12dはチョークコイル14の第2の端子と接続されている。

【0022】接続点10ないし11はさらに結合回路網16ないし17と接続されている。結合回路網16、17のそれぞれの第2端子24、25は被覆室15と接続されている。接続点10にはコイル19の第1の端子が接続されている。コイルの第2の端子はコンデンサ18の端子と接続されている。コンデンサの第2の端子は接続点11と接続されている。

【0023】結合回路網8、9、と16、17は、ダイオード、抵抗およびコンデンサからなる直列回路からなり、全体でアースに対して直流電圧電位を形成している。

【0024】前記の装置では、中位周波発生器13が正弦波状の交流電圧を形成する。この交流電圧は変成器12により電圧領域がマグネトロンカソード1、2の動作電圧に適合するように昇圧される。カソード1、変成器12、カソード2を含む前記の回路によて、2つのカソード間での導電接続路が形成される。この導電接続路により変成器12を介して交流電圧が誘起される。この手段により、ある時点ではカソード1がマイナス極、すなわち放電のスパッタ部を形成し、カソード2が放電のプラス極を形成するようになる。また別の時点ではカソード1が放電のプラス極を形成し、カソード2がマイナス極となり、それによりスパッタされる。

【0025】中位周波電圧の周波数は、プラズマ放電が交流電圧の零点通過の際に消失するように低く選定される。プラズマ放電は交流電圧の各半波の際に、電圧が変成器12にて十分に上昇すると直ちに新たに点弧する。【0026】この交互の作用により、放電は常にスパッタリングにより輝く表面をプラス極として見るようになる。一方のカソードがプラス極として用いられれば、このカソードはこの時点でスパッタしている他方のカソードにより非導電層が被覆される。交流周波数は、被覆がプロセスに対して影響を及ぼさないように高く選定されなければならない。

【0027】接続線路22に並列に、接続点10と11の間、ないし2つの給電線路20、21の間には第2の接続線路28が設けられている。この第2の接続線路には整流ダイオード26と抵抗27が挿入接続されている。ここでは、整流ダイオード26のカソードが第1の給電線路と接続され、整流ダイオード26のアノードが抵抗27と接続され、この抵抗が第2の給電線路21と接続される。

【0028】ダイオード26によって、接続点10が接続点11よりも負になるとき電力の一部が抵抗27に導出される。この電力がスパッタカソード1に利用され

る。交流電圧が転極した後、ダイオード26は遮断し、 スパッタカソード2が全電力でスパッタリングする。

【0029】物理的機構は直流電圧スパッタリングと同 じであるから、もちろんアークも発生する。しかしアー クの発生は、ターゲット表面に対する条件の他に、時間 条件、電流条件および電位条件と結び付いている(交流 周波数を、アークが形成され得るよりも前に極性が既に 変化するように選択すれば)。チョーク14によって、 点弧およびアーク形成の際に電流上昇が遅延される。コ イル19およびコンデンサ18から形成される発振回路 は動作周波数よりも格段に高い周波数-約50倍-に調 整されている。アークが発生しようとするとこの発振回 路が発振し、カソードの付加的な極性交番を生ぜしめ る。それによりアークは直ちに消失する。結合回路網 5、6ないし16、17によって電極5、6と被覆室1 5の電位が、室15に僅かな磁界強度しか発生せず、そ れによりアーク形成が同様に遅延されるように保持され る。以下の手段の組み合わせにより実質的にアークが発 生しないようになる:導電的に接続された2つのカソー ド、周波数、チョーク、電位調整のための結合回路網。

【0030】\*動作周波数に対しては40kHzが最適であると判明した。8kHzから70kHzの領域内での40kHzとは異なる周波数の適用は品質の劣化を甘受すれば考えられる。

【0031】\*単相交流電流の代わりに多相(3相)交流電流による装置を使用することもできる。

【0032】\*変成器12には複数の二次巻線を設けることができる。それにより複数のカソード対を駆動することができる。

【0033】\*カソードの構成は、並置する他に、

- はめ込み構造にする、
- 基板状に屋根構造にする、
- ーメッシュ状基板と共に中央に対向配置する、
- 4極子のように空間的に分配する、
- ことができる。

【0034】\*ターゲット材料が2つのカソード1、2

で同じ場合、基板平面に異なる被覆率分布を形成することができる。

【0035】カソード1に、カソード2とは別のターゲット材料を被覆する場合は、異なる混合比を基板平面に調整することができる。層の組成をその厚さに依存して変化することも(グラディエント層)、層の組成を基板の線膨張に依存して変化することもできる。

【0036】\*適用されるカソードの構造形状は平坦型マグネトロンの他に、

- 中間極ターゲット、
- -管状マグネトロン、
- トロイダル形マグネトロン、

とすることができる。

[0037]

【発明の効果】本発明により、マグネトロンスパッタ源を用いた被覆プロセス中に、反応雰囲気中に発生するアークを可能な限り完全に消失させるか、またはアーク形成の傾向が高まるプロセスフェーズ中に既に、この傾向を識別しこれを阻止するように構成することができる。

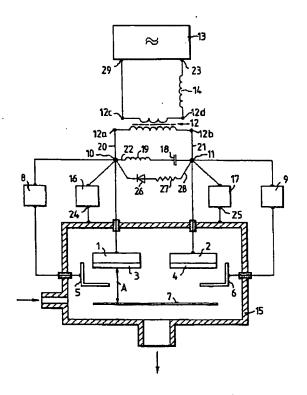
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の装置の回路模式図である。

【符号の説明】

- 1、2 カソード
- 3、4 ターゲット
- 5、6 アノード、電極
- 7 基板
- 8、9 電気結合回路網
- 10、11 接続点
- 12 変成器
- 13 中位周波発生器
- 14 チョークコイル
- 15 被覆室
- 16、17 結合回路網
- 18 コンデンサ
- 19 コイル

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 ゲッツ テシュナー ドイツ連邦共和国 ゲルンハウゼン アム フェルゼンケラー 2